

非接触・非破壊で『厚み』測定ができる！

非接触光学厚み計・顕微分光膜厚計 Otsuka 大塚電子株式会社

非接触光学厚み計



タッチパネルで
操作かんたん
すぐに
結果が
わかる

厚膜
10μm～
5mm

不透明、粗面、
変形しやすい厚みを
非接触で測る
厚み計

◎ サンプルの位置調整不要

◎ トレイにサンプルをセット ◎ 測定完了



◎ 高い繰り返し性・再現性

◎ 検量線なしで絶対厚みがわかる

◎ 測定径が微小だから
ムラの影響を受けない

◎ 安定性が高く誤差が発生しない

電池材

不織布

ゲルシート

金属板

樹脂

セラミックシート

色付きシート

多孔質シート

不透明

 サンプルに

透明

 サンプルに

各種フィルム

光学材料

DLC

センサー

半導体デバイス

◎ たった1台で実現する“オールマイティ”

絶対反射率測定

膜厚解析

光学定数解析

◎ 複数点解析機能により、精度良くnk解析が可能

◎ 微小エリア測定で狙ったパターンを
高精度に測定できる

顕微分光膜厚計



エリプソ
メータに
匹敵する高性能な
膜厚計

薄膜
1μm～
92mm

高速
1秒

多層

■非接触光学厚み計 仕様

	AT-1500	AT-5000
	10 μ m～1.5mm	200 μ m～5mm
繰返し性	0.1nm(2 σ)以下(1mmのゲージブロック測定)	
サンプルサイズ	最小 ϕ 10mm 最大100mm (測定位置は中央部)	
測定径	約20 μ m	
測定時間	1秒以下	
装置サイズ・重量	W300×D364×H400(mm)・20(kg) (本体部：開発中に付き変更になる場合があります。)	
電源	AC100-220V/200VA	

■顕微分光膜厚計 OPTM series 仕様

	OPTM-A1	OPTM-A2	OPTM-A3
波長範囲	230～800nm	360～1100nm	900～1600nm
膜厚範囲 * ₁	1nm～35 μ m	7nm～49 μ m	16nm～92 μ m
サンプルサイズ	最大200×200×17mm		
測定径	ϕ 10 μ m(反射20倍レンズ)、その他		
測定時間	1秒/1ポイント		
装置サイズ・重量	本体:W555×D537×H559(mm) コントロールユニット：W500×D180×H288(mm)		
電源	750VA		

※上記は自動XYステージ付きの仕様となります。*1:膜厚範囲はSiO₂換算となります。



明治電機工業株式会社

本社 (052)451-7651
 四日市営業所 (059)353-0241
 名古屋北営業所 (0587)59-6331
 豊田支店 (0566)81-9121
 豊橋営業所 (0532)53-5050
 東京支店 (045)476-5601
 西東京営業所 (042)660-0676
 仙台営業所 (022)771-0460
 大阪営業所 (06)6338-3021
 福岡営業所 (092)414-9551
 ソリューション事業本部 (052)451-7658
 エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
 業務部 (052)451-7651

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

S

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。